

卒業研究報告

題目

論理回路に対する抗ノイズテストパターン生成

指導教官

高橋寛教授

王森レイ講師

報告者

～～

平成～～年～月～日提出

愛媛大学工学部情報工学科情報システム工学講座

目次

第 1 章 まえがき	1
第 2 章 準備	2
2.1 諸定義	2
2.2 商品識別システムの概要	2
第 3 章 抗ノイズテストパターン生成法	3
第 4 章 実験結果・考察	4
第 5 章 あとがき	5
謝辞	6
参考文献	7

第 1 章

まえがき

近年の日本において，少子高齢化の進行により，生産年齢人口は 1995 年をピークに減少に転じており，総人口も 2008 年をピークに減少に転じている．

第 2 章

準備

本章では，本論文で使用する用語，研究方針のフロー，商品識別システムの概要について述べる．

2.1 諸定義

2.2 商品識別システムの概要

第 3 章

抗ノイズテストパターン生成法

本章では，V字開発モデルによる要求定義，基本設計，詳細設計について述べる．3.1 節ではユースケース図を用いて，商品識別システムの要求定義を述べる．3.2 節ではクラス図を用いて，商品識別システムの基本設計について述べる．3.3 節ではシーケンス図を用いて商品識別システムの詳細設計を述べる．

第 4 章

実験結果・考察

第 5 章

あとがき

評価. 考察.

謝辞

本研究を進めるにあたり, 懇篤な御指導, 御鞭撻を賜りました本学高橋寛教授に深く御礼申し上げます.

本論文の作成に関し, 詳細なるご検討, 貴重な御教示を頂きました本学樋上喜信准教授に深く御礼申し上げます.

また, 審査頂いた本学岡野大准教授ならびに宇戸寿幸准教授に深く御礼申し上げます.

最後に, 多大な御協力と貴重な御助言を頂いた本学工学部情報工学科情報システム工学講座高橋研究室の諸氏に厚く御礼申し上げます.

参考文献

- [1] Bram Kruseman , Ananta K. Majihi , Wilmar Heuvalman , Jennifer Dworak
“NIM-X : A Noise Index Model-Based X-Filling technique to Overcome the Power
Supply Switching Noise Effects on Path Delay Test” IEEE Trans. on VLSI Test
Symp. ,pp.809-813, May. 2012.